Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/518,153	NAKAHARA ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Sikyin Ip	1742	

r		 				
SEARCHED						
Class	Subclass	Date	Examiner			
148	400					
420	557					
	560-562	9/30/2005	SI			

INT	ERFERENC	E SEARCH	ED
Class	Subclass	Date	Examiner
	<u> </u>		

(INCLUDING SEARCH STRATEGY)				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DATE	EXMR		
STN				
eDAN inventor names searched	9/30/2005	SI		
object in the second of the se	3,00,2003	0.		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	-			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				